**Nazwa przedmiotu:**

Metrologia techniczna

**Koordynator przedmiotu:**

Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Mechatronika

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

MTE

**Semestr nominalny:**

4 / rok ak. 2012/2013

**Liczba punktów ECTS:**

3

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Wykład 15, ćwiczenia laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 5, zapoznanie się z literaturą 5, opracowanie sprawozdań 5, przygotowanie do zaliczeń 5.
Razem 55h =2 ECTS.

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

Wykład 15, ćwiczenia w laboratorium 15.
Razem 30h = 1ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

Obecność w laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 5, opracowanie sprawozdań 5.
RAZEM 25h =1ECTS

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład:  | 15h |
| Ćwiczenia:  | 0h |
| Laboratorium:  | 15h |
| Projekt:  | 0h |
| Lekcje komputerowe:  | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Podstawy metrologii, Pomiary i analiza wymiarowa, Miernictwo elektryczne i elektroniczne, Podstawy inżynierii fotonicznej. Wymagana znajomość podstaw projektowania urządzeń mechatroniki, podstaw technik wytwarzania oraz podstaw automatyki, robotyki i informatyki.

**Limit liczby studentów:**

350

**Cel przedmiotu:**

Znajomość budowy, działania i własności metrologicznych urządzeń pomiarowych oraz procedur i technik pomiarowych, ukierunkowanych na pomiary i kontrolę wymiarową, w tym mikro- i makrogeometrię powierzchni przedmiotów stosowanych przemyśle maszynowym, precyzyjnym, motoryzacyjnym, lotniczym, aparaturowym i sprzętu gospodarstwa domowego. Umiejętność tworzenia aparaturowych systemów stosowanych w kontroli jakości procesów i wyrobów.

**Treści kształcenia:**

Wykład: Przetworniki i aparatura pomiarowa: Analogowe przetworniki przemieszczeń. Przetworniki przemieszczeń ze zliczaniem impulsów i kodowe. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe Roboty i centra pomiarowe. Techniki pomiarów wybranych wielkości geometrycznych: Pomiary za pomocą długościomierzy i wysokościomierzy. Pomiary mikrogeometrii powierzchni. Pomiary odchyłek kształtu.
Laboratorium: Pomiary struktury geometrycznej powierzchni za pomocą profilometrów. Pomiary odchyłek okrągłości, metodami bezodniesieniowymi - analiza sygnału cyfrowego przy różnej filtracji i powiększeniu. Pomiary średnic otworów przy użyciu długościomierzy. Wyznaczenie niedokładności pomiaru Pomiary precyzyjnego elementu metodą pojedynczych punktów w trybie manulanym i CNC na WMP, Pomiary elementu złożonego metodą skaningową. Wyznaczenie wynikowych wymiarów złożonego elementu maszynowego na podstawie pomiarów dokonanych na mikroskopie warsztatowym. Wyznaczenie wynikowych wymiarów złożonego elementu maszynowego na podstawie pomiarów dokonanych przy użyciu wysokościomierza.

**Metody oceny:**

Laboratorium: Sprawdziany wstępne przed każdym ćwiczeniem. Zalicza ustalona liczba uzyskanych punktów za sprawdzian i za sprawozdanie z ćwiczenia.

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

1. W.Jakubiec, J.Malinowski: „Metrologia wielkości geometrycznych”. WNT. Warszawa, 2004. 2. E.Ratajczyk: „Współrzędnościowa technika pomiarowa”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa,2005. 3. J.Arendarski, J.Gliwa-Gliwiński, Z.Jabłoński, E.Ratajczyk, J.Tomasik, S.Żebrowska-Łucyk: „Sprawdzanie przyrządów do pomiaru długości i kąta”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2003. 4. J.Arendarski: „Niepewność pomiarów”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2003. 5. M.Wieczorowski, A.Cellary, J.Chajda: Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni czyli o chropowatości i nie tylko”. Wyd. Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych. Politechnika Poznańska. Poznań, 2003. 6. Liubimov V., Oczoś K.: „Struktura geometryczna powierzchni”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2003.

**Witryna www przedmiotu:**

http://zmiij.mchtr.pw.edu.pl/przedmiot.php?class\_id=20&subj=4&page=5

**Uwagi:**

Brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt K\_W01:**

Znajomość budowy, działania i własności metrologicznych urządzeń pomiarowych wielkości geometrycznych

Weryfikacja:

Zaliczenie egzaminu

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W11

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W02, T1A\_W03

**Efekt MTE\_02:**

Znajomość budowy przetworników pomiarowych wielkości geometrycznych stosowanych w urządzeniach mechatroniki

Weryfikacja:

Egzamin

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W11

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W02, T1A\_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt K-U01:**

Opanowanie procedur i technik w zakresie realizacji pomiarów wielkości geometrycznych

Weryfikacja:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U13, K\_U15

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U08, T1A\_U16, T1A\_U09, T1A\_U16

**Efekt MTE\_U02:**

Opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie opracowania wyników pomiarów w szczególności wielkości geometrycznych

Weryfikacja:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U11

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U02, T1A\_U08, T1A\_U09

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt MTE\_K01:**

Potrafi współpracować w zespole

Weryfikacja:

Zaliczenie laboratorium

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_K04

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_K03, T1A\_K04, T1A\_K05